

G 01 N 27/62

Ans.nr.: 3813/85

Int. ans.nr.: PCT/US84/01509

Int. indleveringsdag: 20 sep 1984

Videreførelsesdag: 22 aug 1985

Indleveret: 22 aug 1985

Løbedag: 20 sep 1984

Alm. tilgængelig: 22 aug 1985

Prioritet: 23 dec 1983 US 564959

*SRI INTERNATIONAL; Menlo Park, US.

Opfinder: Christopher H. *Becker; US, Keith T.

*Gillen; US, Sidney E. *Buttrill Jr.; US.

Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S

Fremgangsmåde og apparat til overfladediagnose

SAMMENDRAG

3813-85

Fremgangsmåde og apparat til massespektralanalyse af ukendte substanser, som forekommer på en overflade i ekstremt lave koncentrationer. En prøvestråle såsom en ionstråle, elektronstråle eller laser rettes mod overfladen, som skal undersøges, for at fjerne en materialeprøve. En ikke-tunet højintensitetslaser rettes mod et rumligt område nær overfladen. Laseren har tilstrækkelig intensitet til at fremkalde en høj grad af ikke-resonant og dermed ikke-selektiv fotoionisering af materialeprøven i laserstrålen. Den selektivt ioniserede prøve underkastes derefter massespektralanalyse for at bestemme arten af de ukendte substanser.

3813-85

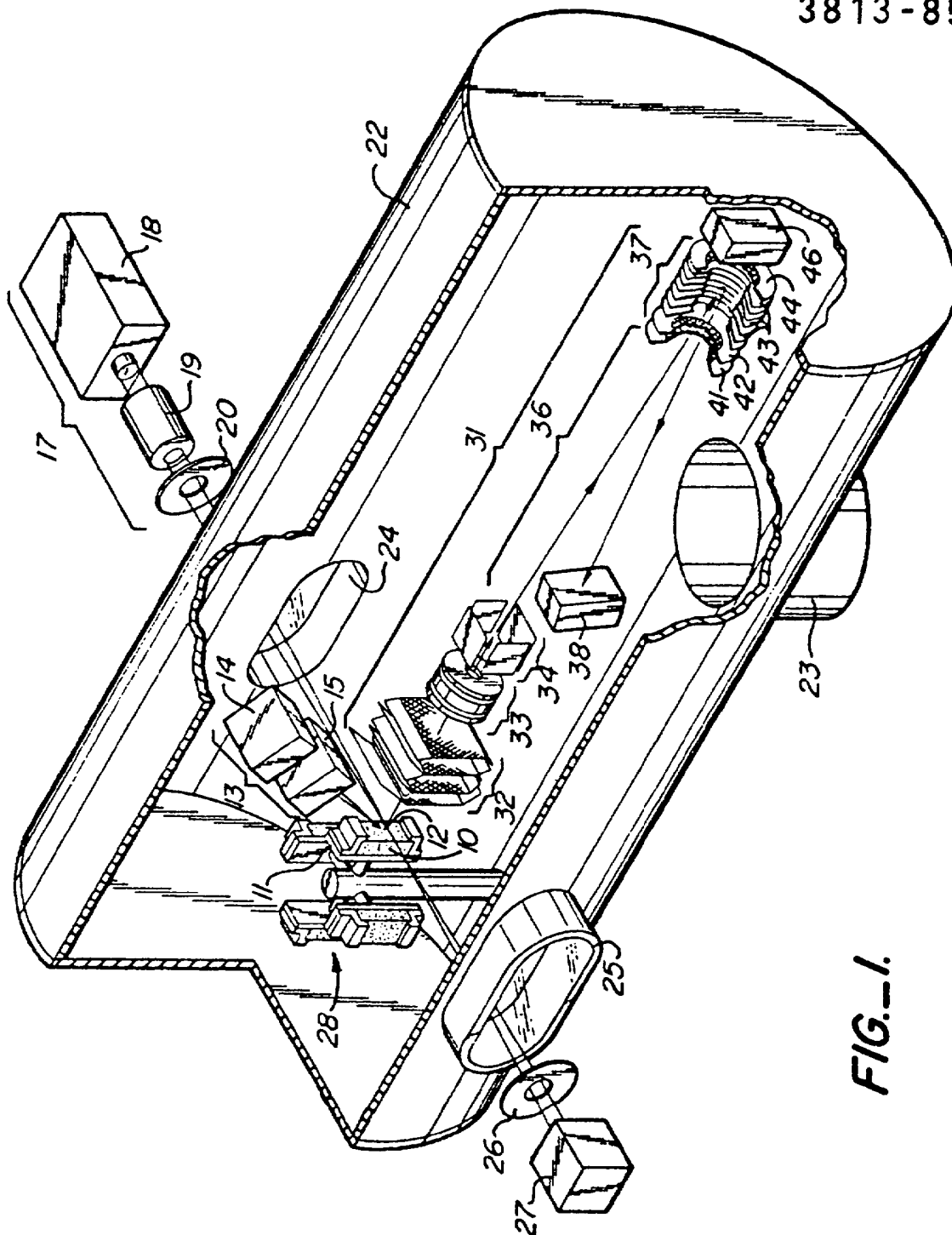


FIG.-1.